

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 25 年 1 月 17 日 (2013.1.17)

【公表番号】特表 2010-501855 (P2010-501855A)  
 【公表日】平成 22 年 1 月 21 日 (2010.1.21)  
 【年通号数】公開・登録公報 2010-003  
 【出願番号】特願 2009-525604 (P2009-525604)  
 【国際特許分類】

G 0 1 N 23/04 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 23/04

【誤訳訂正書】  
 【提出日】平成 24 年 11 月 21 日 (2012.11.21)  
 【誤訳訂正 1】  
 【訂正対象書類名】明細書  
 【訂正対象項目名】0 0 3 1  
 【訂正方法】変更  
 【訂正の内容】  
 【0 0 3 1】

図 4 b に示す重み関数は、実装が特に簡単であり、また、全体として、またはウィンドウの中間点から測定して、0 周期の範囲を表わす単独値によってパラメータ化しやすい。

図 4 に示す関数をパラメータ化する一例においては、この関数を

【数 2 9】

$$Fn_i(A, B)$$

で表わすことができ、ここで A は、測定ウィンドウに取り込まれるサンプルの数を表わし、B は、非ゼロ重みが適用される第 1 の部分 4 1 (サンプルセットとみなすことができる) で発生するサンプル数を表わす。ハードウェアまたはシステムは、このパラメータ化から、非ゼロ重みづけが適用される測定ウィンドウ内の第 2 の部分 4 2 の存在を推論することができる。後述するように、このパラメータ化方式は拡張可能である。